

SEK芯片级制冷型面阵光纤光谱仪

微弱光检测/1044x64像素探测器/主动芯片级制冷



芯片级制冷

科研级性能

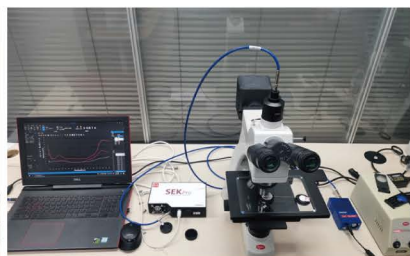
微弱光检测

应用案例

- 拉曼光谱分析
- 荧光检测
- 气体分析
- 食品安全
- 过程控制
- 农业检测
- 药物标记检测
- 果品分析

产品特征

- 1044x64像素大面阵探测器
- 交叉式Czerny-Turner光学平台
- 支持多种外触发模式
- 16位、18位A/D转换
- 支持多种光栅选择
- 提供多种宽度狭缝
- 主动芯片级TEC制冷



技术参数

探测器参数	
探测器	Hamamatsu TEC制冷型CCD
入射狭缝(um)	5、10、25、50、100、200
光栅	Grating_#1
像素点数	1044x64
消高阶处理	根据所选波长配备合适消高阶滤光片
电参数	
A/D位数	16位或18位
接口	USB、串口、SPI
外触发接口	辰昶GPIO, 30pin, 支持辰昶外扩展采集卡
触发模式	4种触发模式: 软件模式(freeRun)/ 电平触发/沿触发/同步
功耗	250 mA @ 5 VDC
结构参数	
体积(长*宽*高)	195mm*120mm*45mm
重量	1.2kg
接口	SMA905
光学参数	
波长范围	200nm-980nm
光学分辨率	0.41nm FWHM (典型值)
波长分辨率	0.18nm (典型值, 与波长范围有关)
线性度	>99%
积分时间	7ms~15min
暗噪声	9RMS Counts
动态范围	光谱:10000:1
信噪比	1000:1
光学系统	100mm焦距, F/#:4.5, 交叉CT光路

产品优势

为您定制

波长200nm到980nm, 狭缝5um-200um;

主动制冷

主动芯片级制冷, 信噪比更高;

工业集成

尺寸更小、更薄, 集成到设备中更方便;

弱光检测

多像素, 高信噪比, 便于弱光检测;

同步控制

集成辰昶GPIO接口, 支持USB、串口、SPI;

快速开发

提供软件开发工具, 支持Window、OSX、Linux系统, 支持多种编程语言。



扫一扫
关注辰昶仪器官方微信
获取更多产品信息»